

- [4] Альтшулер Е.Л., Трунов Н.Н. – Измерительная техника, 1986, № 9, с. 4–6.
- [5] Rendell R.W., Girvin S.H. – Phys. Rev., VB29, N 10, p. 61119–61122.
- [6] Mac Donald A.H., Rice T.T., Brinkman W.F. – Phys. Rev., VS 28, N 6, p. 3648–3650.

Поступило в Редакцию
26 ноября 1987 г.

Письма в ЖТФ, том 14, вып. 9.

12 мая 1988 г.

ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЕ СВЕТОДИОДЫ НА ОСНОВЕ
GaInAsSb ($\lambda = 2.2$ мкм, $\eta = 4\%$, $T = 300$ К)

А. Индаспава, А.Н. Баранов,
А. Гусейнов, А.Н. Именков,
Л.М. Литвак, Г.М. Филаретова,
Ю.П. Яковлев

1. Спектральный диапазон длин волн 2–2.5 мкм перспективен для волоконно-оптических линий связи третьего поколения, а также для целей влагометрии и газового анализа. Среди соединений A^3B_5 наибольший интерес для создания высокоэффективных светодиодов в указанном спектральном диапазоне представляют многокомпонентные твердые растворы *GaInAsSb*, изопериодные к подложке *GaSb*. Эти твердые растворы были успешно использованы как для создания лазеров [1–3], так и фотоприемников [4], работающих при комнатной температуре.

Первая работа по светодиодам на основе *GaInAsSb* была выполнена авторами [5]. В качестве активной излучающей области использовался *p-GaInAsSb*, а в качестве широкозонного эмиттера – *n-GaSb*. В таких светодиодах был достигнут максимальный квантовый выход $\eta = 1\text{--}1.5\%$ и получено быстродействие $\sim 10^{-7}$ с.

В данной работе рассматриваются электролюминесцентные свойства светодиодов в указанном спектральном диапазоне с существенно большими квантовым выходом и быстродействием.

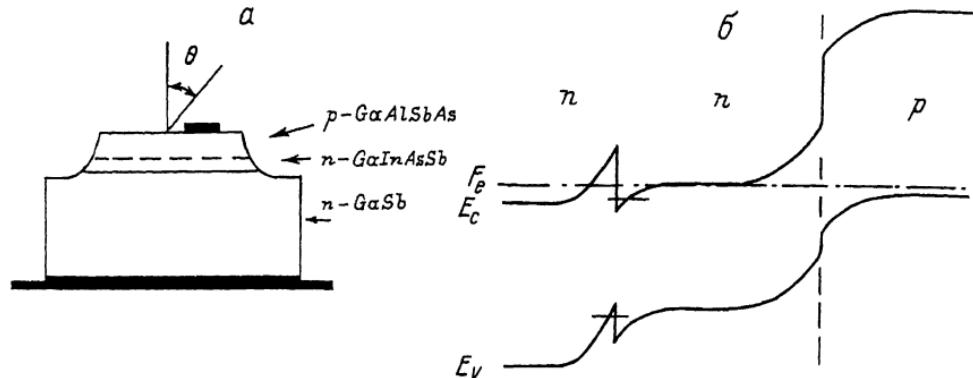


Рис. 1. Светодиодная структура на основе *GaInAsSb*.

а – схема мезадиода, б – энергетическая диаграмма структуры.

2. Светодиоды представляли собой структуру (рис. 1, а), состоящую из активного слоя *n*-*GaInAsSb* ($E_g \approx 0.58$ эВ) толщиной 2–3 мкм, выращенного на подложке *n*-*GaSb* (Ш)В, легированной теллуром до концентрации носителей $(7\text{--}9) \cdot 10^{17}$ см $^{-3}$, и широкозонного эмиттера *p*-*GaAlAsSb* ($E_g = 1.2$ эВ), легированного германием до концентрации $5 \cdot 10^{18}$ см $^{-3}$. Исследовались структуры с различным уровнем легирования активной области теллуром в интервале концентраций $(5\text{--}7) \cdot 10^{17}$ см $^{-3}$. Из такой структуры были изготовлены мезасветодиоды (диаметром 300 мкм) со сплошным напыленным омическим контактом к *n*-*GaSb* (*Au + 5% Te*) и точечным (диаметром 50 мкм) напыленным омическим контактом (*Au + 5% Ge*) к *p*-*GaAlAsSb*.

Исследовались спектры излучения и его угловое распределение, характеристики ток–напряжение (I – U), интенсивность излучения – ток (Φ – I), а также быстродействие светодиодов.

Приемником излучения служил фотодиод, изготовленный нами на основе *GaInAsSb* [4].

3. Электролюминесцентные и электрические свойства *p*-*n*-*GaAlAsSb/GaInAsSb* светодиодов при комнатной температуре следующие.

Спектр излучения содержит только одну полосу полушириной $\delta = 0.06\text{--}0.07$ эВ (рис. 2, а), энергия максимума которой практически не зависит от уровня легирования активной области.

Внешний квантовый выход излучения измерялся с помощью калиброванного фотодиода как для случая вывода излучения через одну грань γ_1 , так и для случая вывода излучения через все поверхности светодиода γ_e . Квантовый выход излучения через одну грань находился в интервале значений 1.3–3.5%, а общий квантовый выход излучения – в пределах 3–4.5% при токе 30 мА и практически не зависел от уровня легирования активной области. Результаты исследования параметров светодиодов сведены в таблицу.

Интенсивность излучения Φ при малых токах $I < I_{\gamma} = 4\text{--}8$ мА увеличивалась сверхлинейно с ростом тока $\Phi \sim I^{\pi}$, где $\pi = 4\text{--}5$, а I_{γ} – пороговый ток резкого возрастания квантового выхода

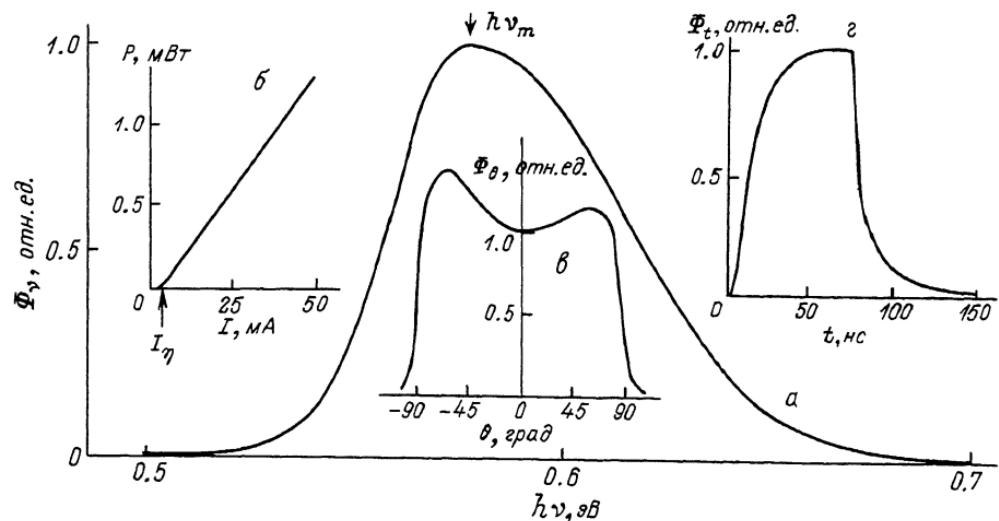


Рис. 2. Электролюминесцентные характеристики светодиодов при комнатной температуре. а - спектр излучения, б - зависимость мощности излучения P от тока I , в - диаграмма направленности излучения, г - зависимость интенсивности излучения Φ от времени t при питании структуры прямоугольными импульсами тока $I = 50$ мА, длительностью 70 нс.

излучения (рис. 2,б). При больших токах $I > I_\theta$ в интервале токов 10–100 мА $\pi = 1.1\text{--}1.3$.

В угловом распределении излучения нет ярко выраженной направленности (рис. 2,в). Тем не менее следует отметить, что интенсивность излучения в направлении перпендикулярном к плоскости р-п-перехода, на 20–30% меньше, чем под углом 70–80 градусов к этому направлению.

Падение напряжения на светодиоде при малых токах $I < I_\theta$ выражается зависимостью $U = \sqrt{3} kT \ln \frac{I + I_0}{I_0}$, где $\beta = 1.2\text{--}1.3$, $I_0 = 0.2\text{--}0.6$ мкА. При больших токах $I > I_\theta$ после появления излучения β уменьшается до 1, а $I - U$ – характеристика выражается зависимостью

$$U = \frac{kT}{q} \ln \frac{I + I_1}{I_1} + \frac{kT}{q} \ln \frac{I + I_2}{I_2} + IR_S,$$

где $I_1 = 0.01\text{--}0.1$ мкА, $I_2 = 0.2\text{--}0.9$ мА, $R_S = 1\text{--}2$ Ом. Если первое слагаемое ответственно за падение напряжения на р-п-переходе, а третье – на последовательном сопротивлении диода, то второе слагаемое, вероятно, ответственно за падение напряжения на п-п-переходе структуры (рис. 1,б).

Характеристики исследованных светодиодов

Светодиод №	n , см^{-3}	$\hbar\nu_m$, эВ	δ , эВ	γ , %	γ_e , %	τ_ϕ , нс	τ_I , нс
АГ-59-5	$7 \cdot 10^{16}$	0.565	0.06	1.6	4.0	11	10
АГ-58-1	$6 \cdot 10^{16}$	0.580	0.069	1.4	3.0	12	10
АГ-57-4	$5 \cdot 10^{16}$	0.579	0.067	1.3	3.2	11	10
АГ-56-2	$5 \cdot 10^{16}$	0.579	0.068	3.5	4.5	10	9

Переходные электролюминесцентные характеристики при прямоугольном импульсе прямого тока ($I = 200$ мА) имеют следующие параметры (рис. 2,г) (см. таблицу). Импульс света нарастает и спадает экспоненциально, и постоянная времени нарастания и спада τ_ϕ практически одинакова и составляет 10–15 нс. Время жизни неосновных носителей заряда, определенное из величины экстрагируемых зарядов при переключении прямого тока на обратный, находится в пределах $\tau_I = 9$ –11 нс.

4. Достижение более высокого внешнего квантового выхода излучения ($\gamma_e > 1.5\%$) по сравнению с работой [5] связано не только с высоким внутренним квантовым выходом излучательной рекомбинации, но и выходом значительной части излучения за счет многократного отражения света в мезаструктуре.

Достижение же высокого внутреннего квантового выхода излучательной рекомбинации может быть связано с уменьшением доли безызлучательной рекомбинации и проявлением эффективной излучательной рекомбинации инжектированных носителей на п-п-гетерогранице.

Поскольку в качестве активной области использовался *n-GaInAsSb*, то можно ожидать существенное уменьшение доли безызлучательной рекомбинации за счет более низкой скорости ударной рекомбинации, чем в р-области *GaInAsSb*. В результате это может привести к общему уменьшению скорости рекомбинации в тонком активном слое ($d \leq 3$ мкм) и проявлению рекомбинации через потенциальные ямы на п-п-гетеропереходе.

Ряд фактов указывает на то, что в исследуемых диодах может иметь место рекомбинация через квантовые состояния на п-п-границе. Большая полуширина спектра излучения ($\delta \sim 70$ мэВ) может быть связана с тем, что степень вырождения в квантовой яме для электронов на п-п-гетерогранице больше, чем в толще активной области. А независимость времени жизни неосновных носителей заряда от степени легирования активной области также может свидетельствовать в пользу рекомбинации через квантовые состояния на п-п-границе. Кроме того, практически скачкообразное увеличение внешнего квантового выхода излучения с ростом тока и увеличение

крутизны $I - U$ - характеристики при токе 4-8 мА также может быть связано с излучательной рекомбинацией через квантовые состояния на п-п-гетерогранице.

В заключение выражаем благодарность А.А. Рогачеву за стимулирующие дискуссии и поддержку работы, С.С. Архиловой - за сборку приборов.

Л и т е р а т у р а

- [1] Бочкарёв Э.А., Долгинов Л.М., Дракин А.Е., Дружинина Л.В., Елисеев П.Г., Свердлов Б.Н., Скрипкин В.А. - Квантовая электроника, 1986, т. 13, в. 10, с. 2119-2120.
- [2] Datt B.V., Temkin H., Kolb E.D., Sunder W.A. - Appl. Phys. Lett., 1985, v. 45, N 2, p. 111-113.
- [3] Баранов А.Н., Джуртанов Б.Е., Именков А.Н., Рогачев А.А., Шерняков Ю.М., Яковлев Ю.П. - Письма в ЖТФ, 1986, т. 12, в. 11, с. 664-667.
- [4] Андреев И.А., Афраилов М.А., Баранов А.Н., Данильченко В.Г., Мирсагатов М.А., Михайлова М.П., Яковлев Ю.П. - Письма в ЖТФ, 1986, т. 12, в. 21, с. 1311-1315.
- [5] Долгинов Л.М., Дружинина Л.В., Мильвидский М.Г., Мухитдинов М., Михаев Э.С., Рожков В.М., Шевченко Е.Г. - Измерительная техника, 1981, в. 6, с. 65-67.

Физико-технический
институт им. А.Ф. Иоффе
АН СССР, Ленинград

Поступило в Редакцию
19 января 1988 г.

Письма в ЖТФ, том 14, вып. 9

12 мая 1988 г.

ОТКЛОНЕНИЕ ПУЧКА ЭЛЕКТРОНОВ С ЭНЕРГИЕЙ 1.5 МэВ ИЗОГНУТЫМИ ТРУБКАМИ

А.Ю. Басай, С.А. Воробьев,
В.В. Каплин, Е.И. Розум,
А.М. Слупский

Выполненные в последние годы работы по канализированию заряженных частиц в изогнутых монокристаллах [1, 2] стимулировали исследования отклонения потоков излучений изогнутыми поверхностями и волноводами [3-5]. В работах [6, 7] было показано, что